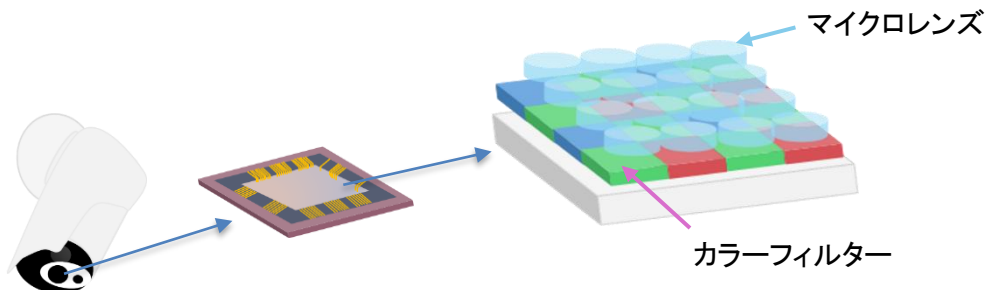


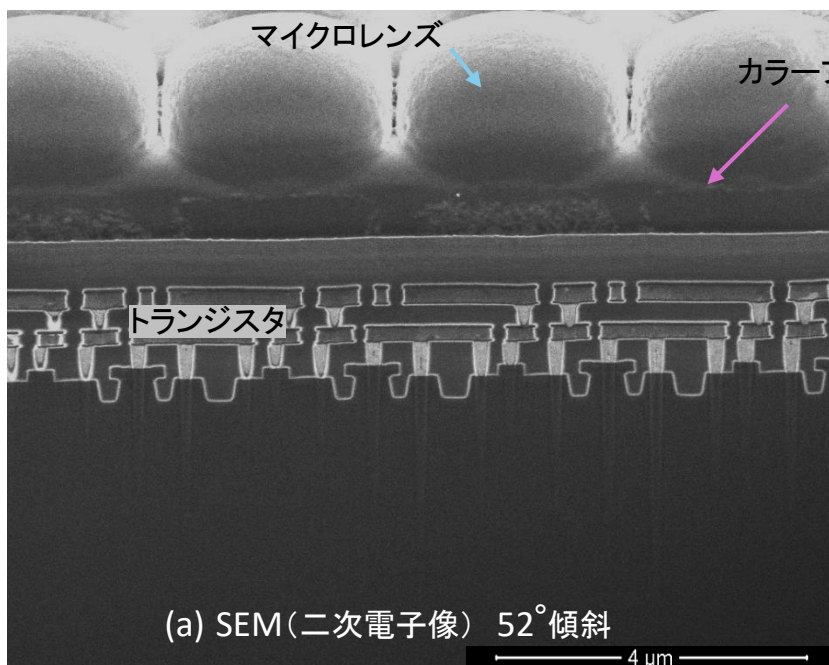
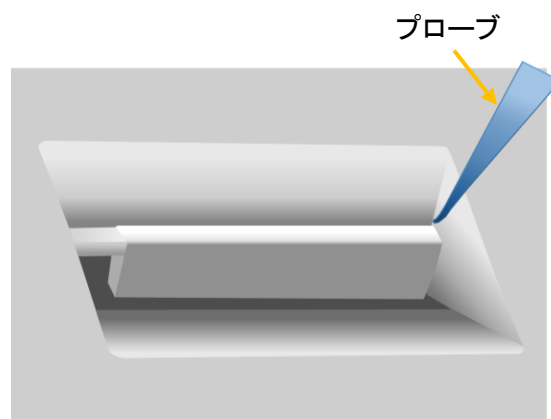
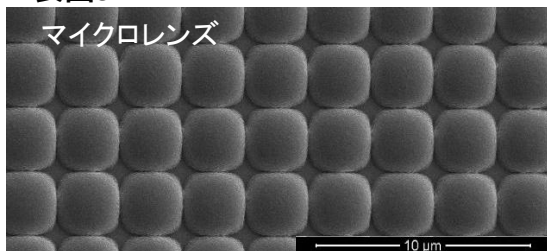
## CMOSカメラ 撮像素子のFIB断面作製

集束イオンビーム加工装置(FIB)は、特定の位置で平滑な断面を作製することができます。市販のWebカメラの撮像素子を取り出し、FIBでSEM観察用、TEM観察用の断面サンプルを作製いたしました。

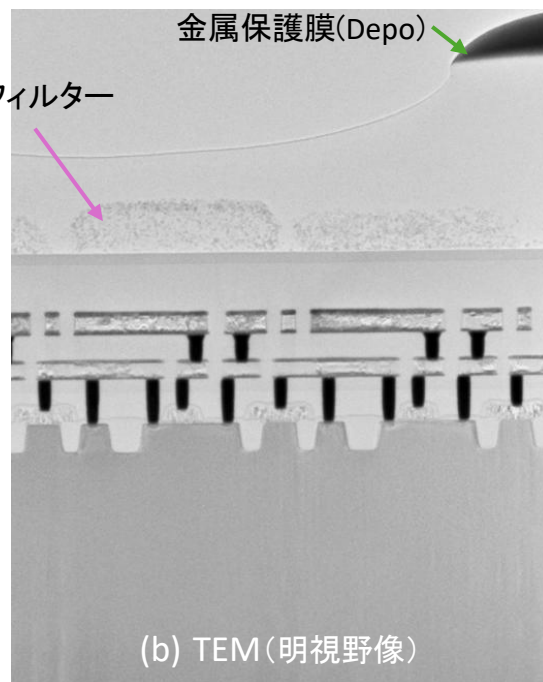


撮像素子表面にあるマイクロレンズの下には、トランジスタ構造があります。断面作製位置により確認できる形状は様々です。

### <表面SEM>



(a) SEM(二次電子像) 52°傾斜



(b) TEM(明視野像)

削れる状態をSEMで確認しながら特定位置の断面を作製し、そのままSEMで観察を行います(a)。

表面保護膜(Depo)を作製し、特定箇所を含む領域を取り出し、観察面の表裏面を確認しながら加工を行います(b)。

お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

<https://iontc.co.jp/contact>

